

附表 105年太陽光電高效率模組產品規格表

項目	規格	
效率(%)* (Efficiency)	單 晶	多 晶
	≥ 17.5 %	≥ 16.6 %
電致衰減** (Potential Induced Degradation, PID)	依照電致衰減測試方法，功率衰減率5 %(含)以下。	

*1.效率(%)=最大功率(W)/模組外框面積(m²) / 1,000 W·m⁻²× 100 %。

2.模組輸出功率測試方法依照 IEC 61215測試標準，測試條件為 10.6節標準測試條件(STC)

3.IEC 61215 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules –Design qualification and type approval。

**1.電致衰減測試方法係依照 IEC/TS 62804-1 2015測試標準，或於環境試驗箱內以模組溫度(85 ± 2)°C、試驗箱相對濕度(85 ± 3)%、施加模組電壓-1,000 V 條件，進行96小時以上。

2. IEC/TS 62804-1 Test methods for detection of potential-induced degradation of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules。